

**ДИНАМИКА ИЗЛУЧЕНИЯ ГЕТЕРОЛАЗЕРА  
С НАСЫЩАЮЩИМСЯ ПОГЛОТИТЕЛЕМ,  
ПОЛУЧЕННЫМ ГЛУБОКОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИОНОВ  
КИСЛОРОДА**

Журавлев А. Б., Плявенек А. Г., Портной Е. Л.,  
Серегин В. Ф., Стельмах Н. М., Якубович С. Д.

Проведены экспериментальные и теоретические исследования автомодуляционного или пикового режима генерации гетеролазера с быстродействующим насыщающимся поглотителем, созданным с помощью облучения торца гетеролазера ионами высокой энергии. Показано, что уменьшение времени релаксации неравновесных носителей приводит к увеличению диапазона токов инжекции, при которых наблюдается автомодуляционный режим, и позволяет получить большие частоты следования (до 10 ГГц) и малые длительности (до 10 пс) оптических импульсов. Теоретическое рассмотрение сделано на основе анализа устойчивости стационарных решений системы балансных уравнений. Представленные экспериментальные данные и результаты машинного моделирования показывают хорошее согласие.

Инжекционные лазеры с управляемым нелинейным насыщающимся поглотителем обладают большими функциональными возможностями, чем обычные лазеры с однородным активным слоем, и в течение многих лет являются объектом детальных исследований [1-4]. Присущие им специфические режимы генерирования света представляют практический интерес для применения в оптических линиях связи, в метрологическом обеспечении измерений быстродействия полупроводниковых приборов и в других областях. Наиболее часто такие устройства реализуются в виде лазерного диода с монолитным резонатором, содержащим два или более изолированных друг от друга участков инжекции. В работе [5] для создания неоднородной активной области использовалась протонная бомбардировка со стороны одного из зеркал собственного резонатора лазерного диода. За счет уменьшения времени жизни неравновесных носителей и уменьшения проводимости имплантированной области в активной среде лазера образуется область сильного поглощения. Размеры этой области определяются длиной торможения протонов в материале активной среды и составляют  $5 \div 13$  мкм при энергии имплантации  $300 \div 500$  кэВ [5]. Экспериментальные исследования лазеров такого типа показывают, что длительность генерируемого светового импульса лежит в пределах  $30 \div 70$  пс [6].

Более короткие световые импульсы (около 10 пс) получены в инжекционных лазерах с насыщающимся поглотителем, создаваемым путем глубокой имплантации ионами кислорода в одно из зеркал лазерного диода [7]. Уменьшение длительности генерируемых импульсов авторы [7] связывают с существенным уменьшением времени релаксации неравновесных носителей заряда в насыщающемся поглотителе, полученном таким образом. Идея сверхбыстрого поглотителя состоит в пространственном разделении областей генерации и рекомбинации неосновных носителей заряда. Как показано в работе [8], в имплантированном ионами кислорода с высокой энергией  $p$ -GaAs время жизни неравновесных носителей составляет 3 пс при дозе облучения  $\sim 10^{12}$  ион/см<sup>2</sup> и 30 пс при дозе  $\sim 10^{11}$  ион/см<sup>2</sup>.

В настоящей работе исследована динамика излучения гетеролазера с насыщающимся поглотителем, полученным имплантацией тяжелых ионов [7]. В эксперименте использовались полосковые AlGaAs-гетеролазеры, у которых

длина активной области  $L$  составляла  $\sim 200$  мкм, длина волны излучения 830 мкм, пороговые токи в непрерывном режиме  $70 \pm 80$  мА. Время спонтанной рекомбинации исходного (неимплантированного) слоя  $\tau_1$ , по осциллографическим наблюдениям, составляет  $1 \pm 2$  нс. Облучение проводилось ионами О<sup>+++</sup> с энергией 18.7 МэВ, глубина проникновения ионов  $\sim 8 \pm 10$  мкм.

Теоретический анализ динамики излучения был проделан на основе часто применяемой эмпирической модели излучательных переходов гетеролазеров [3]. Система балансных уравнений для нормированных электронных концентраций  $v_1$  и  $v_2$  на двух участках активного слоя лазера с относительными протяженностями  $\gamma_1 = l_1/L$  и  $\gamma_2 = l_2/L$  ( $l_1$  — длина неимплантированного участка вдоль оси резонатора,  $l_2$  — длина насыщающегося поглотителя,  $L = l_1 + l_2$ ) и для нормированной интенсивности излучения  $R$  имеет вид

$$dv_1/dt = i - v_1 - R(1 + k \ln v_1), \quad (1)$$

$$dv_2/dt \simeq c; - v_2 (\tau_1/\tau_2) - R(1 + k \ln v_2), \quad (2)$$

$$dR/dt = \{kR \ln(v_1^{\gamma_1} - v_2^{\gamma_2}) + q(\gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2)\}/\Omega, \quad (3)$$

где  $i = j_1/j_n^{(0)}$ , причем, так как  $\gamma_2 \ll 1$ , можно считать, что  $i = J/J_n^{(0)}$  ( $j_1$  — плотность тока инжекции на первом участке,  $j_n^{(0)}$  и  $J_n^{(0)}$  — пороговые плотность тока

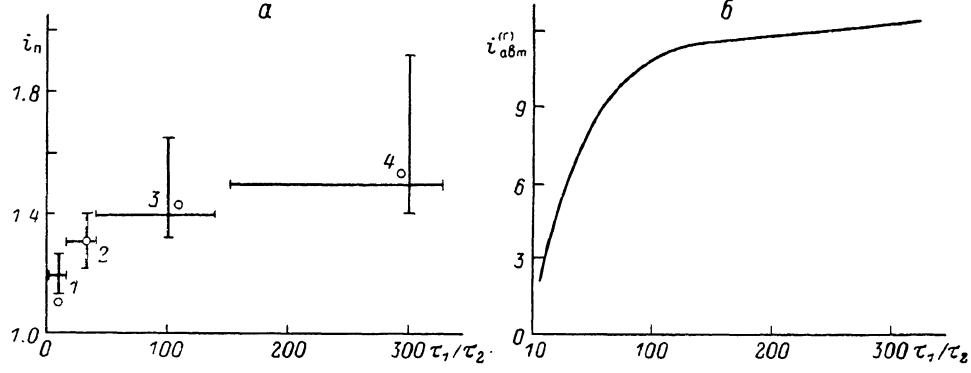


Рис. 1. Зависимости порогового тока (а) и верхней границы автомодуляции (б) от отношения времен  $\tau_1/\tau_2$  для разных доз облучения.

Доза, ион/см<sup>2</sup>: 1 —  $3 \cdot 10^{10}$ , 2 —  $10^{11}$ , 3 —  $3 \cdot 10^{11}$ , 4 —  $10^{12}$ .  $\gamma_1 = 0.95$ ,  $\gamma_2 = 0.05$ ,  $c = 0.1$ ; точки — теория.

и ток инжекции исходного однородного лазера);  $J$  — полный ток инжекции,  $\tilde{t} = t/\tau_1$  ( $t$  — текущее время);  $\Omega$  — отношение времени жизни фотонов в резонаторе к времени спонтанной рекомбинации  $\tau_1$ ;  $\tau_2$  — время релаксации носителей в насыщающемся поглотителе;  $q$  — коэффициент, характеризующий долю спонтанного излучения, попадающего в моды лазера;  $k$  — температурный фактор. В уравнении (2) принято, что эффективную нормированную плотность тока инжекции в насыщающемся поглотителе, которая определяется оптической и гальванической связью между участками лазера, можно приближенно представить в виде  $c \cdot i$ , где  $c = \text{const}$ . Аналитические выражения нормированных величин  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $R$ , а также коэффициента  $k$  приведены в [3]. Теоретическое исследование системы уравнений (1)–(3) проведено при следующих типичных и взятых из эксперимента параметрах:  $\gamma_1 = 0.95$ ,  $\gamma_2 = 0.05$ ,  $\Omega = 2.5 \cdot 10^{-3}$ ,  $q = 10^{-4}$ ,  $k = 1.5$ ,  $\tau_1 = 1$  нс.

Для определения возможных состояний рассматриваемых гетеролазеров и для оценки значения коэффициента  $c$  проанализируем устойчивость стационарных решений системы (1)–(3). Этот анализ показывает, что поле переменных  $i$ ,  $c$  разбивается характеристическими кривыми на области, соответствующие «гладкому» устойчивому режиму генерирования и автомодуляционному или пичковому режиму генерирования лазера. Уменьшение времени релаксации в насыщающемся поглотителе  $\tau_2$  приводит к сильному увеличению диапазона значений тока инжекции, при которых наблюдается пичковый режим генерирования.

В эксперименте пичковый режим контролировался прежде всего осциллографическим методом с использованием стробоскопического осциллографа С1-91/4 и быстродействующего фотоприемника с временным разрешением 100 пс. Регистрировались изменения порогового тока по сравнению со значением для

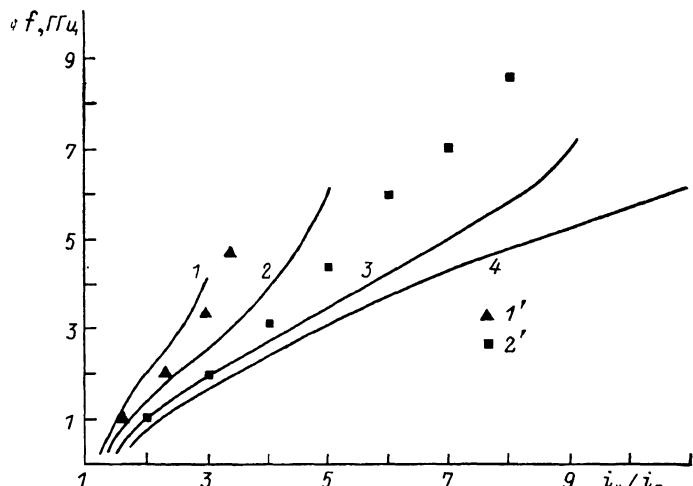


Рис. 2. Зависимость частоты повторения излучаемых импульсов  $f$  от величины превышения тока накачки лазера над порогом генерации для разных времен релаксации насыщающегося поглотителя.

$\tau_2$ , пс: 1 — 100, 2 — 40, 3 — 10, 4 — 1; сплошные кривые — теория, точки — эксперимент для разных доз, ион/см<sup>2</sup>: 1' —  $10^{11}$ , 2' —  $10^{12}$ .  $\gamma_1 = 0.95$ ,  $\gamma_2 = 0.05$ ,  $c = 0.1$ .

неимплантированного лазера  $i_n$ , изменение верхней границы области автомодуляции по току инъекции  $i_{\text{авт}}^{(r)}$  в зависимости от дозы облучения, частота следования оптических импульсов в зависимости от превышения над порогом, время установления пичкового режима. Результаты теоретических и эксперименталь-

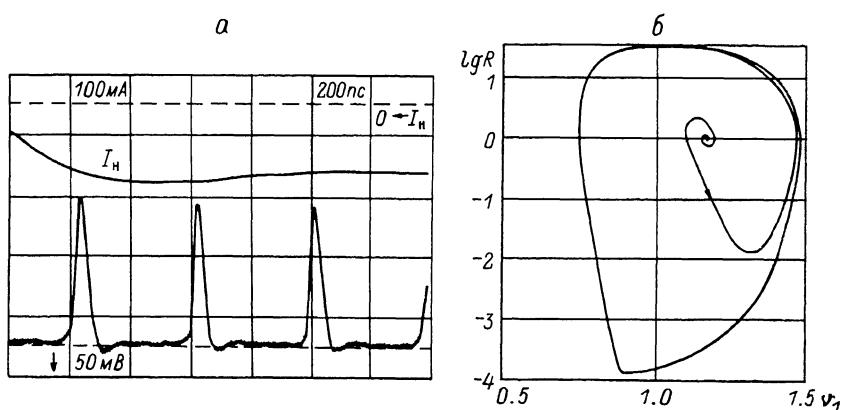


Рис. 3. Осциллограмма (а) и фазовый портрет (б), демонстрирующие весьма малое время переходного процесса установления автомодуляционного режима.

$$E = 18.7 \text{ мэВ}, \varphi = 3 \cdot 10^{11}.$$

ных исследований зависимости  $i_n$  и  $i_{\text{авт}}^{(r)}$  от дозы облучения (и, следовательно, от  $\tau_2$ ) представлены на рис. 1, а, б. Для коэффициента  $c$  здесь и в дальнейшем выбрано значение 0.1. Наблюдается удовлетворительное качественное согласие теоретических расчетов с экспериментальными данными. Несколько большее увеличение порогового тока в эксперименте объясняется, по-видимому, неконтролируемым разбросом величин  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$ , возможным изменением коэффициента  $c$  в зависимости от дозы облучения и вкладом в собственные оптические потери поглощения на аморфизированных областях. Столь малое изменение

порогового тока и столь большое изменение  $i_{\text{авт}}^{(r)}$  при большом изменении времени релаксации поглотителя являются интересными особенностями гетеролазера с насыщающимся поглотителем, полученным имплантацией ионов кислорода.

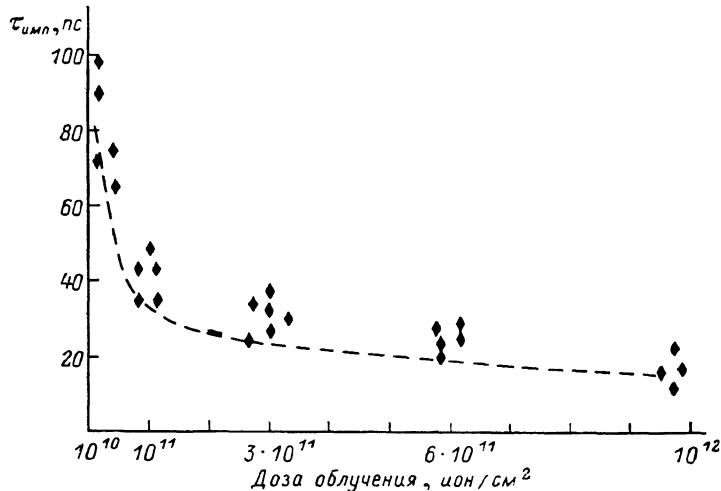


Рис. 4. Зависимость длительности излучаемых световых импульсов от дозы облучения.  
Штриховая кривая — теория.

Кроме того, уменьшение времени  $\tau_2$  приводит к увеличению частотного диапазона пульсаций. На рис. 2 показаны возможность получения частот повторения световых импульсов вплоть до 10 ГГц при 7–10-кратном превышении порога неимплантированного лазера и возможность управления зависимостью частоты повторения импульсов от величины  $i$  изменением времени  $\tau_2$  (изменением дозы

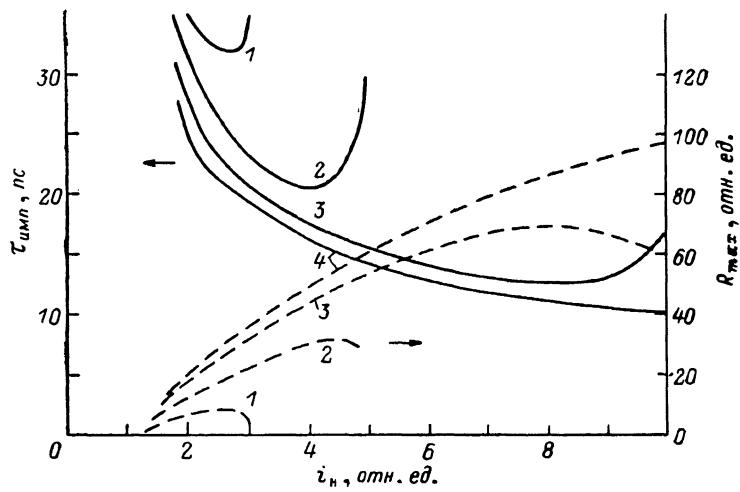


Рис. 5. Теоретические зависимости длительности генерируемых импульсов (сплошные кривые) и их мощности (штриховые) от величины превышения над порогом.  
 $\tau_{\text{имп}}$ , пс: 1 — 100, 2 — 40, 3 — 10, 4 — 1.

облучения). Осциллографическое наблюдение процесса установления пичкового режима (рис. 3) и анализ соответствующего фазового портрета указывают на дополнительную особенность лазера рассматриваемого типа. В отличие от традиционного двухкомпонентного лазера [4] он обладает весьма малой длительностью переходного процесса установления автомодуляционного режима (практически уже второй импульс имеет «стационарные» параметры).

При измерении длительности генерируемых импульсов применялась автокорреляционная методика, использующая квазиколлинеарную схему ГВГ

с двойной модуляцией пропускания плеч модифицированного интерферометра Майкельсона. Временное разрешение схемы определялось эффективной областью взаимодействия световых пучков и, по оценкам, составляло  $0.5 \div 1.0$  пс. Измерения длительности проводились при токах, соответствующих среднему значению между нижней и верхней границами области автомодуляции. Как и ожидалось, уменьшение времени  $\tau_2$  привело к значительному уменьшению длительности генерируемых импульсов. На некоторых образцах получены импульсы длительностью  $\sim 10$  пс. Зависимость длительности световых импульсов от дозы облучения представлена на рис. 4. На рис. 5, а, б изображены теоретические зависимости длительности импульсов  $\tau_{\text{имп}}$  и нормированной пиковой мощности  $R_{\max}$  от  $i$  при различных временах  $\tau_2$ . Для оценок можно считать, что у лазеров данного типа величина  $R_{\max} = 1$  соответствует выходной мощности  $\sim 10$  МВт.

Представленные экспериментальные данные и результаты машинного моделирования показывают хорошее качественное и удовлетворительное количественное согласие, что говорит о том, что использованная схема расчета может с пользой применяться при разработке и оптимизации параметров подобных лазеров.

Высокие технические характеристики и простота изготовления являются очевидным преимуществом полупроводниковых лазеров с насыщающимся поглотителем, полученным глубокой имплантацией тяжелых ионов. Использование подобных приборов в оптических системах обработки информации, требующих малой длительности световых импульсов, представляется особенно перспективным.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Lasher G. J. — Sol. St. Electron., 1964, v. 7, p. 707—715.
- [2] Басов Н. С., Никитин В. В., Семенов А. С. — УФН, 1969, т. 97, в. 4, с. 561—600.
- [3] Ривлин Л. А., Семенов А. Т., Якубович С. Д. Динамика и спектры излучения полупроводниковых лазеров. М., 1983.
- [4] Голдобин И. С., Лукьянов В. Н., Солодков А. Ф., Якубович С. Д. — Квант. электрон., 1985, т. 12, в. 5, с. 953—958.
- [5] Van der Ziel J. P., Tsang W. T., Logan R. A., Augustyniak W. M. — Appl. Phys. Lett., 1981, v. 39, p. 376—378.
- [6] Kuznetsov M., Tsang D. Z., Walpole J. N., Rian Z. L., Ippen E. P. — Appl. Phys. Lett., 1987, v. 51, N 12, p. 895—897.
- [7] Алфёров Ж. И., Журавлев А. Б., Портной Е. Л., Стельмах Н. М. — Письма ЖТФ, 1987, т. 12, в. 18, с. 1093—1098.
- [8] Журавлев А. Б., Морущак В. А., Портной Е. Л., Стельмах Н. М., Титков А. Н. — ФТП, 1988, т. 22, в. 2, с. 352—354.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе АН ССРР  
Ленинград

Получена 28.10.1987  
Принята к печати 5.01.1988